

TECNOLOGÍA ICP-OES DUAL VIEW NO RENUNCIE A NADA

ICP-OES Agilent 5110



EL SISTEMA ICP-OES MÁS RÁPIDO Y PRECISO QUE EXISTE

El sistema ICP-OES Agilent 5110 con Dual View (visualización doble) vertical sincrónica (SVDV) ofrece una combinación perfecta de rapidez y rendimiento analítico, de forma que no tenga que renunciar a ninguno de estos elementos.

Rapidez garantizada

- Realice análisis ICP-OES con gran rapidez y menor consumo de gas.
- Reduzca el coste de análisis y duplique la productividad gracias al sistema avanzado de válvula (AVS).
- Obtenga todas las líneas de emisión en una sola lectura y consiga mayor precisión en menos tiempo.
- Comience a trabajar antes gracias al detector Vista Chip II que no consume argón y reduce el tiempo de calentamiento.

Rendimiento garantizado

- Mida las muestras más complejas con una antorcha vertical.
- Consiga una mayor estabilidad analítica a largo plazo gracias a un nuevo generador de RF de estado sólido.

Facilidad de uso garantizada

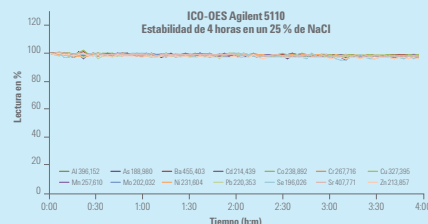
- Conozca de un vistazo todos los elementos que contiene su muestra gracias al modo IntelliQuant.
- Elimine incertidumbres en el desarrollo de métodos gracias al intuitivo software ICP Expert y a la tecnología DSC.
- Asegúrese una puesta en marcha rápida con unas necesidades de formación mínimas gracias a la válvula de conmutación completamente integrada y al uso de una antorcha de tipo *plug and play*.
- Aumente el tiempo operativo de los instrumentos a través de un software de diagnóstico inteligente que simplifica la resolución de problemas.

Configuraciones flexibles

Existen tres configuraciones distintas para el sistema Agilent 5110:

- Dual View (visualización doble) vertical sincrónica.
- Dual View (visualización doble) vertical.
- Visión radial.

El sistema ICP-OES 5110 incluye una antorcha vertical y un robusto sistema de RF de estado sólido en todas las configuraciones, lo que le permite analizar con facilidad las muestras más complejas.



En la imagen se muestran las lecturas expresadas en forma de porcentaje de diversos elementos en una disolución con un 25% de NaCl. La estabilidad de la lectura de todos los elementos presentó una RSD inferior al 1,3% durante más de 4 horas (sin patrones internos).



Agilent Technologies

¿Cómo funciona la tecnología Dual View (visualización doble) vertical sincrónica?

El sistema ICP-OES 5110 SVDV únicamente necesita realizar una medida por muestra. El combinador espectral dicroico permite capturar las visiones axial y radial del plasma en tan solo una lectura y obtener resultados precisos en el mínimo tiempo posible¹.

Reducción enorme del consumo de gas¹

El sistema ICP-OES 5110 ofrece el consumo más bajo de argón por muestra de todos los instrumentos ICP-OES.



55% MÁS RÁPIDO
50% MENOS ARGÓN



Sabía que...

Los sistemas ICP-OES con Dual View (visualización doble) convencionales exigen configurar una serie de medidas secuenciales y seleccionar qué elementos deben medirse en modo axial y cuáles deben medirse en modo radial.

Algunos sistemas también utilizan dos rendijas para medir las longitudes de onda bajas y altas en cada modo, lo que da lugar a hasta cuatro medidas secuenciales por muestra y hace que el análisis de las muestras se ralentice.

1. Los valores de velocidad del análisis y consumo de gas se han comparado con los de los sistemas de la competencia tomando como referencia los datos publicados sobre aplicaciones. Consulte la nota de aplicación 5991-4821EN de Agilent.

Para obtener más información:
Contacte con su representante
local de Agilent o visite
www.agilent.com/chem/5110icpoes

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Publicado el 1 de mayo de 2016
5991-6855ES



Agilent Technologies